



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16894—1997  
idt IEC 747-2-2:1993

---

## 大于100A,环境和管壳额定的整流二极管 (包括雪崩整流二极管)空白详细规范

**Blank detail specification for rectifier diodes  
(including avalanche rectifier diodes), ambient  
and case-rated, for currents greater than 100A**

1997-06-28 发布

1998-03-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
大于 100A,环境和管壳额定的整流二极管  
(包括雪崩整流二极管)空白详细规范  
GB/T 16894—1997

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码: 100045

<http://www.bzcb.com>

电话: 63787337、63787447

1998年5月第一版 2005年1月电子版制作

\*

书号: 155066·1-14826

版权专有 侵权必究  
举报电话: (010) 68533533

## 前 言

本标准等同采用国际电工委员会标准 IEC747-2-2:1993《半导体分立器件第 2 部分:整流二极管第 2 节:大于 100A,环境和管壳额定的整流二极管(包括雪崩整流二极管)空白详细规范》。

本标准按 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第 1 单元:标准的起草与表述规则 第 1 部分:标准编写的基本规定》,除标准名称省去引导要素、增加前言等编辑性变化外,技术内容与 IEC747-2-2 相同,编写方法与其完全对应。这样,通过使我国标准编写格式和规则尽可能与国际一致或等同,以尽快适应国际贸易、技术和经济交流以及采用国际标准飞跃发展的需要。

本标准应与 GB 4589.1—89 半导体器件总规范(IEC747-10—1991)和 GB 12560—90 半导体分立器件分规范(IEC747-11—1985)一起使用。本标准是制订其相同范围产品详细规范的依据。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:北京变压器厂、铁道部永济电机厂、机械部西安电力电子技术研究所。

本标准起草人:雷京贵、李梦录、霍志新、贺宏霞、秦贤满。

## IEC 前言

1) 国际电工委员会(IEC)是世界范围的标准化组织,它由各国国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成。IEC 的目的是促进在电气、电子领域有关所有标准化问题的合作。为此目的并开展了另外一些活动,IEC 发布了国际标准。标准的制订委托给技术委员会,对标准涉及的问题感兴趣的任何 IEC 国家委员会可以参加有关的制订工作。国际上,政府和非政府组织与 IEC 联络也可参加有关的制订工作。IEC 与 ISO(国际标准化组织)按照两个组织一致决定的条件密切协作。

2) 由各技术委员会制订的技术问题的 IEC 正式决议或协议,是所有国家委员会特别感兴趣的,并尽可能就涉及的各种问题表示、表达了国际上的一致意见。

3) 这些决议和协议用标准、技术报告或导则的形式发表,以推荐方式为国际上采用,并在此意义上为各国家委员会所接受。

4) 为促进国际上的一致,IEC 各国家委员会许诺了在本国标准或区域标准中,以最大限度的可能、透明地采用 IEC 国际标准。IEC 标准和国家标准或区域标准的任何分歧之处,应在国家标准或区域标准中清楚地指出。

本国际标准由 IEC 第 47 技术委员会《半导体器件》制订。

本标准是大于 100A、环境和管壳额定整流二极管(包括雪崩整流二极管)的空白详细规范。

本标准的内容基于如下文件:

六 月 法 规 则	表 决 报 告
47(CO)1279	47(CO)1341

赞成本标准的完整的投票情况能在上表指出的表决报告中找到。

出现在本出版物封面上的 QC 编号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范编号。

本标准引用了下列 IEC 标准:

IEC 68-2-17(1978) 环境试验 第 2 部分:试验 Q 密封

IEC 191-2(1966) 半导体器件机械标准化 第 2 部分:尺寸(正在修订中)

IEC 747-2(1983) 半导体器件 分立器件和集成电路 第 2 部分:整流二极管第 1 号修订件(1992)

IEC 747-10(1991) 半导体器件 分立器件和集成电路 第 10 部分:分立器件和集成电路的总规范(第二版)

IEC 747-11(1985) 半导体器件 分立器件和集成电路 第 11 部分:分立器件分规范

IEC 749(1984) 半导体器件 机械和气候试验方法 第 1 号修订件(1991)

中华人民共和国国家标准

大于 100A,环境和管壳额定的整流二极管  
(包括雪崩整流二极管)空白详细规范

GB/T 16894—1997  
idt IEC747-2-2:1993

Blank detail specification for rectifier diodes  
(including avalanche rectifier diodes), ambient  
and case-rated, for currents greater than 100A

引言

国际电工委员会电子器件质量评定体系遵循国际电工委员会的章程,在国际电工委员会授权下开展工作。评定体系的目的是以这样一种方式确定质量评定程序,即一个成员国按照符合适用范围要求所放行的电子器件在其他成员国内无需再试验同样为合格。

本空白详细规范是半导体器件-系列空白详细规范的一个,应该和国际电工委员会的如下规范一起使用。

IEC747-10/QC700000(1991)半导体器件第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC747-11/QC750100(1985)半导体器件第 11 部分:分立器件分规范。

要求的资料

下列所要求的各项内容,应填入下页规定的对应空栏中。

详细规范的识别

- [1] 授权发布详细规范的国家标准化组织的名称。
- [2] 详细规范的 IECQ 编号。
- [3] 总规范和分规范的编号和发布号。
- [4] 详细规范的国家编号、发布日期和国家体系要求的任何更多的资料。

器件的识别

- [5] 器件的型号。
- [6] 典型结构和应用的资料。如果设计一种器件满足几种应用,则应在详细规范中说明。这些应用的特性、极限值和检验要求应予满足。对静电敏感器件或含危险材料如铍的氧化物器件,在详细规范中应写上警告说明。

[7] 外形图和(或)引用有关的外形标准。

[8] 质量评定类别。

[9] 能在器件型号之间进行比较的最重要特性的参考数据。

[在本标准中,方括号内给出的内容供作者制订详细规范时用,而不包括在详细规范中。]

[在本标准中,当特性或额定值适用时,“×”表示在详细规范中应给出的具体值。]